

★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 和田真一 副委員長 萱野良樹
幹事 水上雅人・鈴木健司 幹事補佐 林 優一

日時 3月1日(金) 10:30~16:50

会場 電気通信大学東3号館(総合研究棟)3階306室(調布市調布ヶ丘1-5-1. <http://www.uec.ac.jp/about/profile/access/> 萱野良樹)

議題 ショートノート(卒論・修論特集)

修論

1. DC20V-17Aまでの直流誘導性負荷回路におけるAgSnO₂接点の遮断アーク特性に対する外部磁界の影響に関する検討 ○徳光聖茄・長谷川 誠(千歳科技大)
2. ファブリペロー干渉計による高感度振動検出の研究 ○原田祐弥・栗林 薫・長瀬 亮(千葉工大)・和田 悟(倉橋護謨工業)・小林明夫(東京測振)
3. 締め付けトルクの減少が接触境界の高周波素子に与える影響に関する検討 ○成松 貴・藤本大介・林 優一(奈良先端大)

卒論

4. 光ファイバを用いたひずみセンサの試み ○倉持亮太・松田健太郎・長瀬 亮(千葉工大)
5. SI型マルチモードファイバの入射条件とEAFの関係 ○早崎亮平・長瀬 亮(千葉工大)
6. BOFを用いた超音波振動検出の試み ○高橋 遼・末永克樹・松田健太郎・長瀬 亮(千葉工大)

午後 卒論(13:30~)

7. スナバ回路によるLED電球から発生する電磁ノイズ抑制に関する研究 ○竹内亮汰・堀田柊平・春日貴志(長野高専)・井上 浩(秋田大)
8. GHz帯における損失を含む差動線路のFDTD解析に関する一検討 ○山極大葵(長野高専)・富岡雅弘(秋田大)・北原 廉(長野高専)・中村 篤(UTI)・萱野良樹(電通大)・春日貴志(長野高専)
9. 電磁コンタクトの連続開閉試験による電気接点の接触信頼性の評価 ○五十嵐正成・大垣飛鳥・澤 孝一郎・吉田 清(日本工大)
10. 交流電源での電磁コンタクトに対する開離時アークの諸特性への周囲気体の影響 ○熊谷風馬・五十嵐隆仁・澤 孝一郎・吉田 清(日本工大)

卒論

11. 電気接点の開離時アーク放電に対する電流と磁束密度の磁気吹き消しへの影響 ○眞野健太・澤 孝一郎・吉田 清(日本工大)
12. 電磁コンタクト連続開閉時のアーク継続時間などの諸特性への影響 ○竹内大貴・澤 孝一郎・吉田 清(日本工大)
13. 小電力伝達用金メッキスリップリングの劣化現象に関する研究 ○山木彬嵩・高橋直暉・澤 孝一郎・上野貴博(日本工大)
14. 高速域と低速域における銅接点間の二硫化モリブデン介入の摺動特性 ○飯塚達郎・中野太介・渡辺克忠・上野貴博・澤 孝一郎(日本工大)
15. 銅整流子とカーボンブラシの電気摺動接触におけるアーク消耗 ○鈴木陽大・新谷凱斗・澤 孝一郎・上野貴博(日本工大)
16. 高速回転整流子モータのブラシ摩耗・消耗に関する研究 ○荒井広樹・平林雅登・澤 孝一郎・上野貴博(日本工大)
17. 銀黒鉛質ブラシの銀含有率変化における鉄スリップリングの摺動特性 ○比嘉竜大・高田友輔・福田直紀・澤 孝一郎・上野貴博(日本工大)

◎研究会終了後(17:00~18:00)に懇親会(兼表彰式)を開催します。

【問合先】

和田真一(TMC)

TEL [044] 555-6171, FAX [044] 211-4200

E-mail: s-wada@tmcsystem.co.jp

萱野良樹(電通大)

TEL & FAX [042] 443-5233

E-mail: ykayano@uec.ac.jp

水上雅人(室蘭工大)

TEL & FAX [0143] 46-5307

E-mail: m-mizukami@mmm.muroran-it.ac.jp

鈴木健司（富士電機機器制御）

TEL [048] 547-1037, FAX [048] 549-1825

E-mail : suzuki-knj@fujielectric.com

林 優一（奈良先端大）

TEL [0743] 72-5390, FAX [0743] 72-5391

E-mail : yu-ich@is.naist.ac.jp

©EMD 研究会に関する最新の情報は、<http://www.ieice.org/es/emd/jpn/>を御参照下さい。